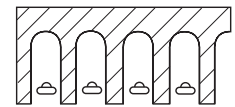


上から見た図

DIPのピン間に“コンタクトが櫛状に”配列されているのでショートがない。



1964年に開発、販売。以来、今日まで市場でDIPテストクリップの王座を守り続けるその理由

- 取付け易さ
高密度なプリント基板に薄いくえ口。リード線の隣接部分の間隔が2.54mmピッチのICにだけ適合
- 確かな接触と保持
くえ口の設計がオープン式になっているのでDIPリードにプローブでアクセス可能
- ハンズフリー検査
“釘頭状”になったピンなのでプローブやテストリードが滑り落ちない(改良型)ので、煩わしさが軽減されます
- 使い易さ
段違いにピンが配列されているのでプローブを上列の長いピンに引っ掛けても、下列の短いピンの邪魔になりません
- 強い押さえ付け力
強力な金属スプリングでガッチリと接触圧を保ち、プローブの重さで検査中のDIPから外れません
- 高信頼性
抜群の信頼性を誇る、コンタクトのこすり付け方式。“アヒルの嘴”状のコンタクトは平なので、狭いDIPのピンから滑り外れる事はありません。ボディには静電防止プラスチック材を使用し、より安全な設計です
- 安全性を重視
ピンのショートの可能性を回避する為にDIP間にコンタクトが櫛状に挿入されているからショートの心配もありません
- 頑丈な構造
長期間の使用に耐えるように鋼製のピボットピンをクリップ本体の関節部に使用
- 豊富な商品群
8ピンから64ピンまでのあらゆるDIPサイズのICがテスト出来るように102種類用意され、用途に合わせて“釘頭状”の改良型と“丸棒ピン”の一般型から選択

仕様	ボディ: ガラス繊維入り(30%) 静電防止プラスチック材 (UL94V-0)、黒色 誘電強度—20KV/mm 表面抵抗— $10^6 \Omega/\text{cm}^2$ コンタクト材: 合金(CuNi18Zn20)メッキ無し、又は金メッキ0.25 μm 付	温度範囲: -55°C~+165°C 相対湿度: 80%以下 最大電流/最大電圧: 2A/250V 試験電圧: 1000V(コンタクトとコンタクト間) 1500V(コンタクトとアース間)
----	---	---

釘頭ピン	丸棒ピン		ピン数	適合デバイス幅 (mm/mil)	寸法(mm) 誤差: ±0.05			
	型番	型番			A	B	C	
CuNi	金メッキ	CuNi	金メッキ	8	7.62 / 300	16.1	12.2	13.3
TC8/A	TC8G/A	LTC8/A	LTC8G/A					
TC14/A	TC14G/A	LTC14/A	LTC14G/A	14	7.62 / 300	18.6	12.2	13.0
TC16/A	TC16G/A	LTC16/A	LTC16G/A					
TC16LSI/A	TC16LSIG/A	LTC16LSI/A	LTC16LSIG/A	16	7.62 / 300	21.1	12.2	13.0
TC18/A	TC18G/A	LTC18/A	LTC18G/A					
TC20/A	TC20G/A	LTC20/A	LTC20G/A	20	7.62 / 300	26.2	12.2	13.0
TC22S/A	TC22SG/A	LTC22S/A	LTC22SG/A					
TC22/A	TC22G/A	LTC22/A	LTC22G/A	22	15.24 / 600	28.8	19.3	20.6
TC24S/A	TC24SG/A	LTC24S/A	LTC24SG/A					
TC24/A	TC24G/A	LTC24/A	LTC24G/A	24	15.24 / 600	31.3	12.2	13.0
TC28S/A	TC28SG/A	LTC28S/A	LTC28SG/A					
TC28/A	TC28G/A	LTC28/A	LTC28G/A	28	15.24 / 600	36.4	12.2	13.0
TC32/A	TC32G/A	LTC32/A	LTC32G/A					
TC36/A	TC36G/A	LTC36/A	LTC36G/A	36	15.24 / 600	46.5	19.3	20.6
TC40/A	TC40G/A	LTC40/A	LTC40G/A					
TC48/A	TC48G/A	LTC48/A	LTC48G/A	48	15.24 / 600	61.8	19.3	20.6
TC64/A	TC64G/A	LTC64/A	LTC64G/A					
				64	22.86 / 900	82.1	26.7	27.4

注) ○数字のピン数はスキニータイプです。ご注文の時には型番にご注意下さい。